

DIN EN 62047-13

ICS 31.220.01; 31.080.01

**Halbleiterbauelemente –
Bauelemente der Mikrosystemtechnik –
Teil 13: Biege- und Scherprüfverfahren zur Messung der Haftfestigkeit
bei MEMS-Strukturen
(IEC 62047-13:2012);
Deutsche Fassung EN 62047-13:2012**

Semiconductor devices –
Micro-electromechanical devices –
Part 13: Bend- and shear- type test methods of measuring adhesive strength for MEMS
structures
(IEC 62047-13:2012);
German version EN 62047-13:2012

Dispositifs à semiconducteurs –
Dispositifs microélectromécaniques –
Partie 13: Méthodes d'essais de types courbure et cisaillement de mesure de la
résistance d'adhérence pour les structures MEMS
(CEI 62047-13:2012);
Version allemande EN 62047-13:2012

Gesamtumfang 17 Seiten

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2012-04-03 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm ist 2012-10-01.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 62047-13:2010-05.

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 631 „Halbleiterbauelemente“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 47F „Micro-electromechanical systems“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Halbleiterbauelemente –
Bauelemente der Mikrosystemtechnik –
Teil 13: Biege- und Scherprüfverfahren zur Messung der Haftfestigkeit bei
MEMS-Strukturen
(IEC 62047-13:2012)

Semiconductor devices –
Micro-electromechanical devices –
Part 13: Bend- and shear- type test methods of
measuring adhesive strength for MEMS
structures
(IEC 62047-13:2012)

Dispositifs à semiconducteurs –
Dispositifs microélectromécaniques –
Partie 13: Méthodes d'essais de types courbure
et cisaillement de mesure de la résistance
d'adhérence pour les structures MEMS
(CEI 62047-13:2012)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2012-04-03 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel